

XRF 膜厚計・素材分析器

膜厚測定

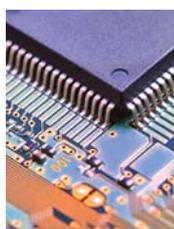
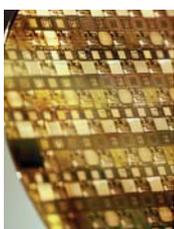
材料分析

液分析

RoHS スクリーニング

多種多様な
産業に貢献

- 自動車産業
- プリント基板製造
- 半導体製造
- コネクタやリードフレーム製造
- ファスナー
- 切削工具
- 機械工具
- 通信機器
- 宝飾品
- 航空宇宙産業



特長

- 最大 5 層*の各層の厚みと合金比率を同時測定
- 直観的な操作が可能なユーザインタフェース
- X線を集光することで高精度な測定が可能

※ 4被膜層と下地

新製品



製品ラインナップ

全ての製品の設計・開発・製造をアメリカで行っています



G シリーズ

エントリーレベル
宝飾品や装飾めっき用
モバイルも可能です



B シリーズ

電気めっき一般むけ
測定頻度の少ない
ユーザーむけ



P シリーズ

電子部品や半導体部品むけ
一般の電気めっきに対応



O シリーズ

測定面が平な電子部品
半導体部品むけ
スポットサイズは 80 μ m 未満
キャピラリ式



K シリーズ

30x30cm の測定エリア
で 22cm 以上の高さに対応



L シリーズ

大型サンプルに対応



M シリーズ

測定面が平な電子部品
半導体部品むけ
スポットサイズは 30 μ m 未満
キャピラリ式



W シリーズ

リードフレームやウエハー用
キャピラリ式
スポットサイズは 7.5 μ m



A シリーズ

半導体むけ
キャピラリ式
自動機に対応可能
スポットサイズは 7.5 μ m

国内総代理店

NIRECO
株式会社ニレコ

制御機器事業部 計測器営業課

〒192-8522 東京都八王子市石川町2951-4
TEL(042)660-7353 FAX(042)660-7354

Web Site <https://www.nireco.jp> Mail info-mis@nireco.co.jp

QI5401.0

このカタログの記載事項は、予告なしに変更される場合があります。ご計画の際は、営業部へ確認くださるようお願いいたします。

Printed in Japan